easyLIGHT XUV

紧凑型平场极紫外光谱仪

Top Unistar
Explore the unknown

VUV
XUV



hpspectroscopy

easyLIGHT XUV

Top Unistar
Explore the unknown

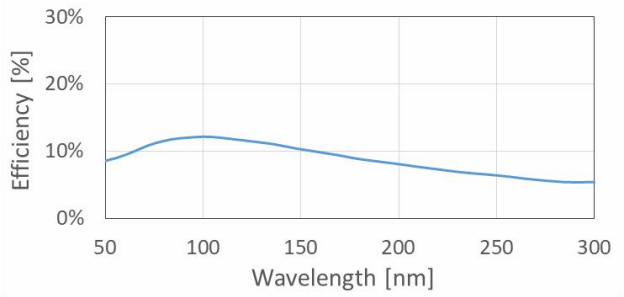
产品特点

直接成像光谱仪

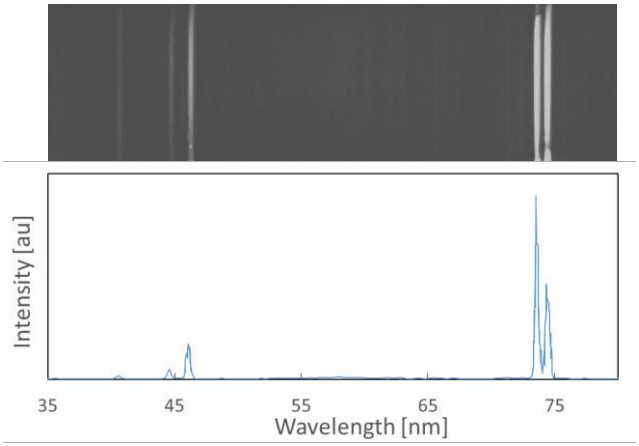
- 覆盖30-250nm波长范围
- 无入射狭缝的光路设计
- 相较标准产品约20倍的收集效率提升以获得极高信噪
- 精准高效
- 高效像差平场校正光栅
- 光栅定位监控，保持光栅校准
- 软件控制光栅
- 双杂散光滤光片
- 结构紧凑

可定制项

- 单台定制，完美匹配用户需求
- 可适配用户实验腔体
- 光谱仪适配用户端探测器
- 用户可定义的滤光片安装方案



Grating efficiency into first order of diffraction.
无狭缝专利技术使总效率比传统光谱仪高20倍



中红外纳秒激光激发，并经750um厚的铝滤片过滤后的氖气光电离等离子体参考光谱示例

easyLIGHT XUV

Top Unistar
Explore the unknown

规格参数

Topology/类型	aberration-corrected flat-field spectrometer 像差校正平场入射光谱仪
波长范围	30-250nm
光源距离	可根据用户实际光路灵活调整
探测器类型	CCD /MCP/CMOS
真空兼容度	<10^{-6}mbar (UHV超高真空版本可定制)
无狭缝技术	含
输入狭缝	可选
光栅定位	闭环电控台
滤光片插入单元	含
数据接口	USB or Ethernet
软件	Windows UI / Labview, VB, C, C++ SDK
定制能力	可根据需求定制
其余可选项	非磁性，旋转几何等

色散能力	~2.0nm/mm
分辨率	<0.1nm
平场面物理尺寸	75mm
偏差角	94°

关注我们

请联系我们

北京众星联恒科技有限公司
北京市海淀区信息路1号国际创业园西区2号楼1305
电话：+86-10-86467571 邮箱:sales@top-unistar.com

hpspectroscopy